



矽电半导体设备(深圳)股份有限公司
Sidea Semiconductor Equipment(Shenzhen)Co.,Ltd.



矽电 PT-9200 产品介绍

为全球客户提供专业、高端的半导体设备

专注探针测试领域 20 年+

PT-9200 自动探针台

产品概述:

- PT-9200适用于最大8英寸的集成电路晶圆自动测试。整机特别针对集成电路多芯多探针及高定位精度的测试需求进行设计，可以满足2000根探针以下的单芯或多芯测试，整机搭载光栅尺闭环系统，综合定位精度 $\pm 2\mu\text{m}$ ，具备高精度、高刚性，高稳定性的特点。

产品特性:

- 高分辨率光学识别、自动对针系统，全自动对针。
- 支持分类测试功能。
- 支持通讯TCP/IP, GPIB, USB等。
- 支持EAP等远程控制探针台。
- 安全防护，测试过程中防开门。
- 配备真空传感器，防止圆片脱落。
- 可扩展的温控系统，支持高低温测试。
- 载台高刚性、高平整性，平整度 $\leq 10\mu\text{m}$ ，适合多芯多针测试，最多支持2000根探针同时测试。
- 测试区域编辑划定，可以提高效率只测试所圈定的芯粒。
- Mapping功能，可以实现测后打点或脱机打点。
- 抽测功能，可实现圆片上不等距步进，任意点测试。
- 具有多Bin分类显示Mapping功能，方便分析圆片参数分布状况。
- 配备CCD系统可做有效晶粒全扫描后测试，提高探针使用寿命，防误测。



具体规格

电脑配置

操作系统	Windows7&10
PC机硬盘	≥20G
显示器	23寸
支架	一套

探针台主机

综合定位精度	±2um
重复定位精度	±1um
可测晶圆尺寸	最大8英寸
可测晶圆厚度	50um~1500um
X、Y、Z轴行程	X≥240mm; Y≥340mm; Z≥30mm
θ 轴旋转范围	≥±8°
chuck平面最大移动速度	速度可调, 最大速度≥200mm/秒

chuck

Chuck尺寸	8寸
Chuck耐压	3000 V
Chuck通流	≥200 A
Chuck 高温开路漏电	≤20fA/V
Chuck平整度	≤10 um
Chuck表面镀金	支持

温控系统

测试温度范围	25~ 200 °C
加热速度	从25°C到200°C时间小于30min
降温速度	从200°C到25°C时间小于30min
分辨率	≤0.1°C
均匀性[典型值]	±0.5°C@25~100°C; ±0.5%@100~200°C
高温测试晶圆扩张精度补偿	支持

针座&探针	
精密三维座	螺丝/磁吸式固定
	X-Y-Z方向的移动行程: ≥14毫米
	最小移动分辨率: ≤0.6um
开尔文探针	适用温度: -40°C至+200°C, Leakage Noise: ≤20fA@-40°C至+200°C
DC直流探针	适用温度: -40°C至+200°C,电流MAX≥10A
线缆	DC&三同轴线缆
针卡夹具	支持
针卡定位	支持
显微镜观察系统	
显微镜类型	单筒双目/三目/CCD显微镜
放大倍率	光学放大倍率≥12倍, 倍率可选
XYZ移动范围	X≥25mm、Y≥25mm、Z≥120mm
工作距离	≥40mm
变焦方式	无极连续变焦
光源配备	LED环形光源&同轴光源
辅助功能	
屏蔽箱	EMI屏蔽: 1kHz至1MHz时≥30dB; 光衰减: ≥130dB;
	光谱噪声基底: ≤-180dBVrms/rtHz (≤1MHz) ;
	系统交流噪声: ≤5mVp-p(≤1GHz);
防打火[有氮气/氟油支持]	200°C 3000V 无空气击穿
背金抗氧化装置[有氮气支持]	支持
其他	
三色报警器	支持
与测试机联动	支持国内、外测试机, 支持通讯定制
安全防护	测试过程中锁死, 防止开门
EMO紧急制动功能	支持